**文章编号**: 1000-324X(2008)02-0243-04

# 一步法合成高纯度碳化硅粉体的研究

叶鑫南<sup>1</sup>,赵中玲<sup>2</sup>,兰 琳<sup>1</sup>,黄金秋<sup>1</sup>,林昆仑<sup>1</sup>,陈立富<sup>1</sup>

(1. 厦门大学 特种先进材料实验室, 化学化工学院, 厦门 361005; 2. 黑龙江电力职工大学, 哈尔 滨 150003)

摘要:利用液态硅为原料,以碳和二氧化硅粉末组成的混合物作为催化剂,通过液态硅与一氧化碳之间的气-液相碳热反应,一步合成了高纯度的碳化硅微细粉体,制得的碳化硅粉体的平均颗粒尺寸为 D<sub>50</sub>=0.41μm.利用 XRD、SEM、激光粒度分析和元素分析对粉体进行了表征,并讨论了碳化硅粉体的形成机理.
 关键词:碳化硅粉体,液态硅;气相反应;液相反应;碳热还原

中图分类号: TB383 文献标识码: A

#### One-step Synthesis of High Purity Silicon Carbide Powder

YE Xin-Nan<sup>1</sup>, ZHAO Zhong-Ling<sup>2</sup>, LAN Lin<sup>1</sup>, HUANG Jin-Qiu<sup>1</sup>, LIN Kun-Lun<sup>1</sup>, CHEN Li-Fu<sup>1</sup>

(1. Advanced Materials Laboratory, Xiamen University, Xiamen 361005, China; 2. Heilongjiang Worker University of Electric Power, Harbin 100530, China)

Abstract: Silicon carbide (SiC) powder was synthesized from liquid silicon in one step at the presence of a catalyst bar consisting of silica and carbon. The silicon carbide powders were formed by the carbothermal reaction between liquid silicon and gaseous CO, and the average particle size  $(D_{50})$  of the as-prepared silicon carbide powder was  $0.41\mu$ m. The powder was characterized by XRD, SEM, particle size analysis and elemental analysis. The mechanism for the formation of the silicon carbide powder was discussed.

**Key words:** silicon carbide powder; liquid silicon; gas-phase reaction; liquid-phase reaction; carbothermal reduction

## 1 引言

碳化硅 (SiC) 粉体的制备方法在有关文献中已 经进行了全面和系统的综述<sup>[1-3]</sup>.目前生产中最常 用的为碳热法 (Acheson),是在电阻炉中将石英 (二 氧化硅) 和焦碳 (碳) 加热到 2000°C 以上,生成粗 的 α-SiC 粉体<sup>[1,3]</sup>.反应后的样品中通常存在多余 的碳和石英,一般将样品加热到 600°C 以上氧化去 除多余的碳,用氢氟酸浸泡去除多余的石英,将样 品碾磨和球磨以减小粒度,经过分级处理得到不同 尺寸的 α-SiC 粉体.

根据碳热法原理,陈立富<sup>[4]</sup>以硅酸乙酯和酚 醛树脂为原料,用沉淀法制备前驱体, 1500°C 经

碳热还原反应制得粒度分布范围窄、球状的亚微米 SiC 粉体. Martin 等<sup>[5]</sup> 以硅溶胶和碳黑为原料, 经冷冻干燥后制备前驱体,在1500°C 经碳热还原 反应制得亚微米级的 SiC 粉体. 潘顺龙等<sup>[6]</sup> 以水玻 璃和碳黑为原料,采用沉淀 - 喷雾干燥法制备反应 前驱体,在1500°C 下,经碳热还原反应合成晶粒尺 寸为纳米级的 SiC 粉体.这些方法都实现了在较低 温度下制备超细 SiC 粉体的目的,但是同时也都存 在着原料处理工艺复杂,直接得到的粉体纯度不高 等缺点.本研究提出一种新的 SiC 粉体制备方法, 不需要进一步处理即可得到高纯度亚微米 β-SiC 粉 体.

收稿日期: 2007-03-29, 收到修改稿日期: 2007-05-25 基金项目: 福建省先进陶瓷重大专项基金 (2005HZ02-1); 福建省重点实验室基金 (2006L2003) 作者简介: 叶鑫南 (1983-), 男, 助理工程师. 通讯联系人: 兰 琳. E-mail: xmutc@xmu.edu.cn

#### 2 实验

实验所用的原料包括硅粉 (纯度 >99%,  $\phi$ 70 $\mu$ m, 上海化学试剂厂), 二氧化硅 (纯度 >99%,  $\phi$ 15nm, Degussa, 德国) 和聚丙烯腈 (PAN, 本实验室制备, 用粘度法测量  $M_w$ =1.3×10<sup>5</sup>g/mol). 所有材料不需 任何处理直接使用.

把二氧化硅粉末加入到聚丙烯腈 (PAN) 溶液 中(溶剂为二甲基甲酰胺, DMF, PAN 在溶液中的 浓度为 10%), 二氧化硅相对于 PAN 的含量为 10%; 用机械搅拌器搅拌 5h 使两者混合均匀,将得到的 液体通过一个  $\phi$ 1.5mm 的孔挤出到蒸馏水浴中,样 品凝固成型,所得样品反复用蒸馏水洗涤以彻底去 除 DMF 溶剂,直接将湿的样品放入矩形钢模内以 20MPa 的压力制成条状的生胚,干燥后,将样品在 空气中于 204 °C 氧化 8h; 以高纯氮气作为保护气 体将氧化后的样品在 1000°C 下碳化 30min,使 PAN 转化为碳.处理后的样品实质上是在碳基体上填充 着二氧化硅的复合材料.为了定量测量该复合材料 样品中二氧化硅的含量,将其在空气中于 700°C 处 理 1h,完全去掉所含的碳,余下的就是二氧化硅, 这样得到其化学组成为二氧化硅 14%,碳 86%.

下例是一个典型的合成实验.如图 1 所示,将 碳化的条状样品 (0.51g) 放入装有硅粉 (2.53g) 的高 纯度氧化铝坩埚中 (坩埚的氧化铝含量为 99.5%), 氧化铝坩埚放到一个更大的石墨坩埚中,然后在石 墨坩埚上加石墨盖后放入石墨加热炉内,炉内充高 纯氩气 (>99.9995%),用机械真空泵抽到 500Pa.石 墨盖没有螺纹,只是松松地盖在坩埚上面,没有密 封的作用.整个系统以 20°C/min 的升温速率加热 到 1550°C 保温 60min.实验过程中定期抽真空将压 力保持在 500Pa. 保温后,炉子自然冷却,对得到的 样品进行表征.为了比较,进行了两组对比实验,



图 1 碳化硅粉体合成装置示意图

Fig. 1 Schematic of the assembly for silicon carbide powder synthesis

一是没有加入上述的碳化样品条,另一是加入了 不含二氧化硅粉末的碳化样品条(该样品条的制备 除了第一步没有在 PAN 溶液中加入二氧化硅粉末 外,其余步骤与前述相同).所有的实验至少重复三次.

X 射线衍射 (XRD, X'pert PRO, PANALYTIC Co.) 用作粉体物相分析; 为了观察其形貌, 将粉体 加入到丙酮中超声分散 10min. 滴一滴悬浮液到铝 制样品座上, 等丙酮挥发后, 直接在 SEM(扫描电 镜, LEO-1530, LEO Co.) 上观察; 粉体的粒度及 其分布利用激光粒度仪测试 (OMEC, 型号 LS-POP-III), 该仪器的测量粒度下限为 0.27µm; 样品中的碳 元素由碳硫分析仪 (EMIA-320V, HORIBA Co.) 测 定, 氧元素由氧氮联测仪 (EMGA-620W, HORIBA Co.) 测定. 在假定样品仅由碳、氧、硅组成的前提 下, 硅含量通过计算得到.

#### 3 实验结果

当没有加入碳化样品条或者加入不含有二氧 化硅粉末的碳化样品条时,氧化铝坩埚内的产物为 坚硬、银灰色的块体 (由于热膨胀系数不同,冷却 后氧化铝坩埚出现了裂纹);而当加入含有二氧化硅 的碳化样品条时,坩埚里原来黑色的硅粉变成了非 常疏松的颜色均匀的灰白色粉体 (样品代号 X-06). 图 2 是银灰色块体与 X-06 粉体的 XRD 谱线.可以 看出,银灰色的块体为硅,而 X-06 粉体的谱线对 应于 β-SiC 的衍射峰.即在含有二氧化硅粉末的碳 化样品条的作用下,最终产物为高纯度的 β-SiC 粉 末,其中没有发现作为原料的硅、碳和二氧化硅.

表 1 列出了 X-06 粉体的化学组成. 作为对比, 将美国 Superior-graphite Co. 的 Grade 059 粉体也



图 2 (a) 银灰色块体和 (b)X-06 粉体的 XRD 图谱 Fig. 2 XRD patterns of (a) the silver-gray bulk from the reaction product without the carbonized bars, and (b) the X-06 powder

做了相同的分析,此外表中还列出了根据化学分子 式计算出的 SiC 的理论组分.化学分析表明本研究 所合成的碳化硅粉体纯度很高,这同 XRD 分析的 结果是一致的.

图 3 及表 2 为 X-06 和 Grade 059 SiC 粉末的激 光粒度分析结果.这两种粉体的 Wadell 球形度 (等 表面积球径与等体积球径之比的平方)都接近 1,说 明它们在形状上基本是等轴的; X-06 SiC 粉末的 平均粒径只有 0.41 $\mu$ m,小于 Grade 059 SiC 粉末的 0.51 $\mu$ m,这与它们比表面积差异是一致的. Grade 059 SiC 中 <0.2 $\mu$ m 的 SiC 粉末含量接近零,而 X-06 SiC 粉末中,约有 10% 粒度 <0.2 $\mu$ m.

图 4 是通过 SEM 观察到的 Grade 059 以及 X-06 SiC 粉体的微观形貌.可以看出,两者都是亚微米

表 1 粉体的化学组成 (wt%) Table 1 Chemical composition of X-06 SiC powder (wt%)

	=		
Material	$\operatorname{Carbon}/\%$	Oxygen/%	Silicon/%
X-06	$29.6{\pm}0.18$	$1.2{\pm}0.12$	69.2
Grade 059	$33.0 {\pm} 0.23$	$1.0 {\pm} 0.13$	66.0
Pure SiC	30.0	0	70.0



级粉末,平均粒度相差不大.不过 Grade 059 粉末 具有非常明显的棱角,这是因为该微细粉末是由大 颗粒通过机械粉碎的方法制备的; X-06 粉末的边 角比较光滑,从后面的讨论可知,这是由于该粉末 是通过气相反应一步生成的,没有经过任何的后续 处理.

#### 表 2 激光粒度分析结果

Table 2 Particle analysis of Grade 059 and X-06 SiC powders

Properties	Grade 059 SiC	X-06 SiC
$D_{10}/\mu{ m m}$	0.37	0.23
$D_{25}/\mu{ m m}$	0.44	0.31
$D_{50}/\mu{ m m}$	0.51	0.41
$D_{75}/\mu{ m m}$	0.59	0.50
$D_{90}/\mu{ m m}$	0.64	0.60
Specific surface area $/m^2 \cdot g^{-1}$	12.36	16.65
Volume equivalent diameter/ $\mu$ m	0.51	0.41
Surface area equivalent diameter/ $\mu$ m	0.49	0.36







图 4 (a)Grade 059 SiC 粉末与 (b)X-06 SiC 粉末的 SEM 照片 Fig. 4 SEM photographs of (a) Grade 059 SiC powder and (b) X-06 SiC powder

### 4 讨论

从文献 [1] 可知, 熔融的硅转化为碳化硅有几 种可能的机理. 熔融的硅可能同碳化后样品条中 的碳发生反应生成碳化硅. 但是通过对比实验发 现,加入不含二氧化硅的碳化样品条,所得的产物 仍然是硅,排除了碳化样品条与液态硅反应生产 SiC 粉末的可能. 这是因为当液态硅与碳接触时, 立即在碳表面形成一层 SiC 表面层,阻止反应的进 一步进行,因此液态硅与碳反应生成 SiC 的速度非 常慢.

另外一种生成 SiC 的可能机理是在炉子中含 有一定的氧分压,因此存在一定浓度的 CO,这样 就可能通过反应 (1) 生成 SiC 粉末<sup>[7]</sup>. 但是通过对 比实验,不加入碳化样品条,所得产物仍然是硅, 没有发生明显的变化,排除了炉子内的气氛导致 SiC 生成的可能.

 $2Si(l,g) + CO(g) \rightarrow SiC(s) + SiO(g)$ (1)

由此推断在本工作中,碳化硅是通过气相反应 生成的,而且碳化样品条中的二氧化硅起到了关 键的作用.在本研究中,碳化样品条中的二氧化硅 与碳首先发生反应生成 CO 和 SiO 气体<sup>[8]</sup>:

 $SiO_2(s)+C(g)→SiO(g)+CO(g)$  (2) 然后根据反应 (1),液态硅或者硅蒸气与 CO 反应 生成 SiC. 也就是说碳化硅中的碳是通过一氧化碳 气体的形式提供的.这个反应的自由能可通过以 下公式计算 <sup>[9]</sup>:

$$\Delta G_T^0 = -144410 + 72.77T \tag{3}$$

当 T=1550°C (1823K) 时, 计算可得  $\Delta G_T^0 =$ -11.75kJ/mol. 负的自由能表明从热力学上来说这 个反应是可行的. 在热力学平衡状态, 一氧化碳分 压 ( $P_{\rm CO}$ ) 和一氧化硅分压 ( $P_{\rm SiO}$ ) 是平衡的, 其数值 取决于热力学平衡常数 ( $\kappa_{\rm p}$ )

$$\Delta G_T^0 = -RT \ln \kappa_{\rm p} = -RT \ln \left(\frac{P_{\rm SiO}}{P_{\rm CO}}\right) \tag{4}$$

在 $T=1550^{\circ}$ C时,计算可得 $\frac{P_{SiO}}{P_{CO}}=2.17$ .

最初,我们认为反应(2) 是反应(1)所需一氧 化碳的唯一提供者,也就是说反应(2)中所生成的 一氧化硅蒸气在抽真空时被排出了炉外,没有进 一步参与任何反应.根据反应(1),在本研究中生成 1.75g 碳化硅粉体需要 1.23g 的一氧化碳或者 1.32g 的二氧化硅.但是通过计算发现,实验中二氧化硅 (SiO<sub>2</sub>=14%×0.51=0.07g)的含量太低,不能产生足 够的一氧化碳.所以认为一氧化硅蒸气与碳化样 品中的碳或者外部的大石墨坩埚按照反应 (5) 发生 了反应以提供更多的一氧化碳 <sup>[10,11]</sup>:

SiO(g)+2C(s)→SiO(s)+CO(g) (5) 这个反应中的一氧化硅也可能来源于反应 (2),在 热力学平衡状态,反应 (5)和反应 (1)相互作用,以 维持 <u>Paio</u> =2.17,不断供应一氧化碳保证了反应 (1) 的进行.显然本研究中的一氧化硅是留在了坩埚 内并在其中循环,而不是离开了这个系统.换句话 说,一氧化硅作为中间产物,保证碳化硅形成所需 要的一氧化碳的供应.因为开始反应时原料体系 中只含有硅、碳和二氧化硅,所以本研究所形成的 碳化硅粉体有较高的纯度.

#### 5 结论

利用液态硅为原料,以碳和二氧化硅粉体组成 的混合物作为催化剂,一步合成了高纯度的碳化 硅微细粉体.反应过程中,首先催化剂中的碳和二 氧化硅发生碳热还原反应生成一氧化碳和一氧化 硅,所生成的一氧化碳气体同熔融的硅通过碳热 反应生成碳化硅和一氧化硅,而一氧化硅进一步 同碳或者石墨反应生成一氧化碳,持续提供生成 碳化硅所需的一氧化碳.可见,碳化硅粉体是通过 一氧化碳进行气相传递与液态硅反应生成,所以 最终生成高纯度的碳化硅粉体.

#### 参考文献

- Friedrich Schröder.Gmelin Handbook of Inorganic Chemistry, 8th edition, Berlin: Springer-Verlag, 1986. 178–185.
- [2] Michael B. Bever. Encyclopedia of Materials Science and Engineering, vol 6. New York: Pergamon Press, 1986. 4403–4408.
- [3] 时利良,赵宏生,闫迎辉,等.材料导报, 2006, 20 (6): 239-242.
- [4] 陈立富 (CHEN Li-Fu). 无机材料学报 (Journal of Inorganic Materials), 1994, 9 (4): 465-470.
- [5] Martin H P, Ecke R, Muller E. J. Euro. Ceram. Soc., 1998, 18: 1737–1742.
- [6] 潘顺龙,杨岩峰,张敬杰,等 (PAN Shun-Long, et al). 无机 材料学报 (Journal of Inorganic Materials), 2006, 21 (6): 1319–1324.
- [7] Henry N. Baumann Jr. J. Electrochemical Soc., 1963, 110
   (4): 298–306.
- [8] Kuhn W E. J. Electrochemical Soc., 1963, 110 (4): 298– 306.
- [9] 黄希枯.钢铁冶金原理,第1版.北京:冶金工业出版社, 1981. 295-300.
- [10] Okada K, Kato H, Nakajima K. J. Am. Ceram. Soc., 1994, 77 (6): 1691–1693.
- [11] Kennedy P, North B. Proc. Br. Ceram. Soc., 1983, 33: 1–15.